光電変換物質 π-共役ポリマーの電場吸収・電場発光測定

(北大電子研¹・台湾国立交通大学²) Mehata Singh Mohan,¹ Hsu Chain-Shu,² Lee Yuan-Pern,² O太田信廣¹

「序」 π -共役ポリマーであるポリフルオレン (PF0) やポリフェニレンビニレン (PPV) は、 効率的な光電変換材料として良く知られており、発光ダイオード、薄膜トランジスタ、太陽 電池、レーザー発振、等への応用も含めて多くの研究がなされている。これらの物質を電界 発光素子や太陽電池作成のための光エネルギー変換材料として考えた場合、電子励起状態の 電子構造やダイナミクスが電場印加時にどのような振舞をするかを分子レベルで調べること は、エネルギー変換効率や反応機構および物質の安定性を考える上で非常に重要である。こ こでは、PPV の誘導体である poly(2,3-diphenyl-5-hexylphenylene vinylene), (DP6-PPV) および poly[2-(phenyl)-3-(4'-(3,7-dimethyloctyloxy)phenyl)-1,4-phenylenevinyleneco-2-(11'-decylsulfanylundecanyloxy)-5-methoxy-1,4-phenylene vinylene], (S3-PPV) を対象に、電場吸収および電場発光測定を行い、これら π -共役ポリマーの電子励起状態にお ける電子構造および電場印加時の電子励起状態におけるダイナミクスを調べた。DP6-PPV お よび S3-PPV の分子構造は図1に示してある。

「実験」台湾のグループが合成したこれらの 試料をトルエン溶媒に溶かし、それを透明電 極ITOが蒸着された石英基板上にスピンキャ スト膜を作成するか、もしくは溶媒中にこれ らの試料とポリメタクリル酸メチル(PMMA) を同時に溶かして、試料が PMMA にドープ されたもののスピンキャスト膜を作成し



図1、S3-PPV(左)およびDP6-PPV(右)の分子構造。

た。キャストしたポリマー膜の上からアルミ(AI)を蒸着し、ITOとAIを電極として電場を 印加している。電場吸収スペクトルおよび電場発光スペクトルの測定は、自作の電場吸収・ 電場発光同時測定装置を用いて行った[1]。一定周波数の交流電場を印加し、二倍の周波数 に同期した変調成分をロックイン・アンプを用いて測定している。電場吸収測定では、電場 の方向と励起光の偏光方向のなす角(χ)をいろいろ変えて行っている。発光強度は吸収強度 にも依存することから、電場発光測定は、通常は電場による吸収強度の変化のない励起波長 を選択して行っている。蛍光減衰曲線の電場印加による変化も自作の装置を用いて行ってい る[2]。電場発光スペクトルはこれまでほとんど測定されておらず名前が定まっているわけで はないが、電界発光のエレクトロルミネッセンス(EL)と区別して、エレクトロフォトルミ ネッセンス(E-PL)と我々は最近よんでいる。

「結果と考察」どちらのポリマーも電場吸収スペクトルは、吸収スペクトルの1次微分と2次微分の線形結合として再現することができる。2次微分の寄与が大きく、光励起に伴って 電気双極子モーメントが大きく変化することを示している。すなわちこれらπ-共役ポリマー の電子励起状態は電荷移動状態と考えられる。

E-PL スペクトルはどちらのポリマーも励起波長に依存する。 例えば、S3-PPV の 471、388、

300 nm 励起における E-PL スペクトルが図 2 に示してあ る。いずれも発光スペクトルの零次微分と1次微分の線 形結合として再現することができる。零次微分の寄与は、 発光強度が電場により変化 (強度増加もしくは減少) す ることを示している。長波長励起では、電場により発光 強度が増加し、短波長励起では減少(電場消光)するこ とがわかる。DP6-PPV の場合も励起波長に依存するが、 どの波長励起でも電場消光が観測され、その消光の大き さは短波長励起になるほど大きくなる。すなわち、どち らも励起エネルギーを大きくするにつれて電場消光が 顕著になる。E-PL スペクトルの励起波長依存性は、PF0 の場合にも観測されるが、光誘起電子移動反応を示す電 子供与体と受容体をドープした系、例えばエチルカルバ ゾールとテレフタル酸メチルの場合は観測されず、π-共役ポリマーに特有なもののようである。発光強度の変 化として二つの理由が考えられる。一つは、電場によ り無輻射遷移速度が変化する場合であり、他方は発光 状態の濃度が電場により変化する場合である。そこで、 発光減衰曲線の電場効果を測定した所、電場消光を示 す励起波長では、例えば図3に示すような結果が得ら れた。励起直後の蛍光強度が電場印加時に大きく減少 することを示している。すなわち、光励起により電荷 分離状態が生成し、その状態から電場印加によりイオ ンへの解離が起こっていると考えられる。この電場に より誘導される解離は、励起エネルギーが大きい程よ り効率的に起こるようになり、発光状態の生成量が減 少することになる。この減少は、どの π-共役ポリマー にも共通のように思われる。ちなみに、S3-PPV の長波 長励起における蛍光の電場増強は、電場により蛍光寿 命が長くなることから、無輻射遷移速度が電場により 減少するためであり、電荷状態の解離がそれほど起こ らないことも相まって観測されたと推測される。上で 述べたように、このような励起エネルギーに依存した



図 2、S3-PPV の発光スペクトル (PL) および E-PL スペクトルの励起波長依存 性。赤は 1 次微分と零次微分によるシ ミュレーション。



図 3、DP6-PPV の蛍光減衰(下)、電場の 無い場合に対する有る場合の減衰の比 (中) および差(上)。

電子励起状態からの電場誘起のイオンへの解離は π-共役ポリマー特有であり、効率的な光電 変換素子としての機能と密接に関係していると考えている。

- [1] S. Umeuchi, Y. Nishimura, I. Yamazaki, H. Murakami, M. Yamashita, N. Ohta, Thin Solid Films, 311, 239 (1997).
- [2] M. Tsushima, T. Ushizaka, N. Ohta, Rev. Sci. Instrum., 75, 479 (2004).
- [3] M. S. Mehata, C.-S. Hsu, Y.-P. Lee, N. Ohta, J. Phys. Chem. C 113, 11907 (2009);
 J. Phys. Chem. B 114, 6258 (2010).

炭化ケイ素単結晶のピエゾ抵抗物性シミュレーション

(立命大, BEANS) 〇中村 康一, 鳥山 寿之, 杉山 進

【序】 炭化ケイ素 (SiC) は高い熱伝導率と低い熱膨張率を有するだけでなく、シリコンに比べ てバンドギャップが大きいために高温下でもリーク電流が小さく、高温・高線量環境において利 用できる半導体材料として注目されている。SiC の結晶は積層構造によって決まるさまざまな結 晶多形があり、種類に応じて結晶の電子構造やそれを基にした電気特性も異なる。本研究ではSiC をメカニカルセンサの構成材料として応用することを念頭に、さまざまな結晶多形の単結晶バル クモデルやナノスケール低次元モデルに対する電子状態のひずみ応答を詳細に明らかにするとと もに、ゲージファクターのキャリア濃度および温度依存性を予測してピエゾ抵抗センサの可能性 について議論した。

【計算手法】 一般に、比抵抗テンソル $\dot{\rho}$ はキャリア濃度と有効質量テンソルを用いて表すこと ができる。キャリア濃度と有効質量テンソルは第一原理バンド構造から導出できる物性量であり、 ひずみによってバンド構造が変わるとこれらの物性量が変化して、比抵抗に影響を及ぼすことに なる。SiC のような伝導帯が多谷構造をもつ n 型半導体の場合、キャリア電子に関する電気伝導 率テンソル \dot{G} は各バンドとそれぞれの谷 $\{v_{\alpha}\}$ に対して決まるバンドキャリア密度 $n_{j,\alpha}$, バンド有効 質量テンソル $\hat{m}_{j,\alpha}$ *, および緩和時間テンソル $\hat{\tau}_{j,\alpha}$ を用いて

$$\ddot{G} = \ddot{\rho}^{-1} = e^2 \sum_{j \in \operatorname{CB}_{\nu_{\alpha}}} n_{j,\alpha} (\ddot{m}_{j,\alpha} *)^{-1} \cdot \vec{\tau}_{j,\alpha}$$

$$\tag{1}$$

と書け^[1],第一ブリルアンゾーン(1BZ)を{ v_a }に対応して分割することにより,それぞれのバンドキャリア密度がフェルミエネルギー E_F と温度 T から決定される。n型ドープ状態は「単位格子あたりのキャリア数がごく微小ならばバンドエネルギーは真性半導体と同じ」という仮定の下にフェルミエネルギーをシフトさせることによって表現する^[1-3]。また,緩和時間については,「すべてのバンドの緩和時間が等しく,ひずみのあるなしに関わらず一定」という近似を用いた。この取り扱いは一見粗いようにも思われるが、ピエゾ抵抗係数やゲージファクターを求める際にはキャリア伝導率の比をとるので,緩和時間が打ち消されることを考慮すると簡単で有効な取り扱いである。

ひずみがないときの比抵抗テンソルの対角成分をρ₀とすると、単軸ひずみεに対する縦方向お よび横方向のゲージファクターはそれぞれ、

$$GF_l = \Delta \rho_l / \rho_0 \varepsilon; \quad GF_t = \Delta \rho_t / \rho_0 \varepsilon \tag{2}$$

と表される。ただし、 $\Delta \rho_l$ および $\Delta \rho_l$ は単軸応力を加えた向きを座標軸の1つとしたときの比抵抗 テンソル対角成分変化量であり、 $\Delta \rho_l$ は単軸応力と平行な向きの変化量、 $\Delta \rho_l$ は垂直な向きの変化 量をそれぞれ表す。

【結果および考察】 本研究で取り扱ったバルク SiC の単位格子を	Table 1. Ca	alculated band	
図1に示す。GGA レベルの第一原理電子状態計算を行ったところ。	gaps of bulk SiC (eV) _o		
	3C-SiC	1.36	
よく知られているとおりにすべてのバルクモデルにおいて多谷構	2H-SiC	2.27	
<u> 洗われっ仁道世が犯された。明体がいじゼェップの計管は(ま 1)</u>	4H-SiC	2.00	
迫をもう仏导市が侍られた。间後ハンドイヤックの計昇値(衣 I)	6H-S1C	1.81	-
は、立方晶である関亜鉛鉱型 3C-SiC において特に狭くなる。			

立方晶 3C-SiC の伝導帯の谷は逆格子空間座標 軸と1BZ境界との交点上の6箇所にあり、バル クシリコンの伝導帯の谷とは位置が異なるが, 等バンドエネルギー面はバルクシリコンの場合 と同様に回転楕円体構造となる。[001]方向や [110]方向に単軸引っ張りひずみを加えると、等 しかった 6 箇所の谷底のバンドエネルギーに高 低差が生じ、等価に分布していたキャリア電子 がエネルギーのより低い谷に優先して分布する ようになるため,伝導性が大きく変化する。-方,[111]方向の単軸引っ張りひずみを加えても6 箇所の谷は等価のままなので伝導性は大きく変 化せず、ピエゾ抵抗特性はモビリティの変化の みによって決まる。それぞれの単軸引っ張りひ ずみに対し, GF₁および GF₁はそれぞれバルクシ リコン^[1,4]と定性的に同じ結果となった。

六方晶では結晶多形の種類によって谷の位置 が異なり、伝導率のひずみ応答に違いがみられ る。六方晶ウルツ鉱型 2H-SiC では伝導帯の最も 深い谷が 1BZ 境界上の K 点に 6 箇所存在するが (図 2(a))、[0001]方向だけでなく[1T00]方向の単 軸引っ張りひずみに対しても 6 箇所の谷は等価 の関係を保持するため、[0001]方向および[1T00] 方向の両方とも大きなピエゾ抵抗効果は見られ ない。対照的に、4H-SiC では伝導帯の最も深い 谷が 1BZ 境界上の M 点にあり(図 2(b))、[1T00] 方向の単軸引っ張りひずみによって谷底のバン ドエネルギーに高低差が生じるため、伝導性が



Fig. 1. The primitive unit cells of silicon carbide (SiC) polymorphs in our simulation: (a) 3C-SiC, (b) 2H-SiC, (c) 4H-SiC, and (d) 6H-SiC. There are 1, 2, 4, and 6 [SiC] units in the primitive unit cells, respectively.



Fig. 2. Images of the first Brillouin zones and carrier distribution on the multi-valley band according to the [1100] tensile strain: (a) 2H-SiC and (b) 4H-SiC.

変化して比較的大きな負の GF_l が得られた。6H-SiC でも M 点付近に伝導帯の谷が存在し、4H-SiC と同様のピエゾ抵抗物性が得られた。

さらに、さまざまな結晶多形に関するナノシート構造を表現し、低次元化した場合の電子状態とn型半導体電気特性についても検討した。低次元モデルのバンド構造は閉じ込め(confinement) 効果によってバルク SiC モデルの結果と対応づけられ、(111)面方位をもつナノシート構造においては(001)面方位のナノシートで観察できる擬直接バンドギャップ^[2]が発現しなかった。

*GF*₁ および *GF*₁ はキャリア電子分布の変化に起因するピエゾ抵抗効果の場合について顕著なキャリア濃度および温度依存性が見られる^[1]。詳細な定量的議論については当日報告する。

- [1] K. Nakamura, Y. Isono, T. Toriyama, and S. Sugiyama, Phys. Rev. B 80, 045205 (2009).
- [2] K. Nakamura et al., IEEJ Trans. Electr. Electron. Eng. 5, 157 (2010); Jpn. J. Appl. Phys. 49, 06GH01 (2010).
- [3] K. Nakamura et al., Jpn. J. Appl. Phys. 47, 5132 (2008); Jpn. J. Appl. Phys. 48, 06FG09 (2009).
- [4] C. S. Smith, Phys. Rev. 94, 42 (1954).

スピロピランに対するずれ応力効果

(山口東理大工^{*}・中部大工^{**}・分子研^{***}・室蘭工大工^{***})
 ○井口 眞^{*}・大嶋 修平^{*}・坂井 亮介^{*}・花田 唯^{*}・清水 佑季子^{*}
 籔内 一博^{*,**}・薬師 久弥^{***}・城谷 一民^{****}

【序】フォトクロミック分子のスピロピラン(spiropyran, SP)の固相でのずれ応力によるクロミ ック挙動を調べている[1-4]。6-ニトロスピロピラン(NitroSP、Fig1.a)は、ずれ応力によって メロシアニン(merocyanine, MC)への異性化が誘起され、淡黄色から緑・紫色への色変化を示 す。本研究では、NitroSP、HydroxySP(b)、NaphtoSP(c)のずれ応力によるクロミック挙動をま とめ、ラマンスペクトルと MC 凝集体の生成から機構について考察する。



【実験】・応力実験: ずれ応力実験には、DAC を改造した回転式サファイアアンビル高圧セルを用いた。上下アンビル(φ1.5 mm)間の試料を加圧後、下アンビルの回転によってずれ応力を作用させた。試料の色の変化を観察し、ラマンスペクトル(Renishaw Ramascope 1000,励起光 785 nm)を測定した。・メロシアニン(MC)凝集体の調製: NitroSP の無極性溶媒であるシクロヘキサン溶液に紫外光を照射すると、濃紫色の MC 凝集体が生成する。HydroxySP とNaphtoSP についても同様の方法を用いた MC 凝集体の調製を試みた。

【結果・考察】

表1に、NitroSP、HydroxySP、NaphtoSPのずれ応力によるクロミック挙動と MC 凝集体

の生成についてまとめる。NitroSP (淡黄 色)と HydroxySP(白色)は、ずれ応力によ って緑色、応力を抜くと紫と青色に変化 し、緑と紫 / 青色の間は可逆であった。 可視光の照射によって、NitroSP の紫色は 淡黄色に戻ったが、HydroxySP の青色は 変化しなかった。また、NaphtoSP(白色) は、ずれ応力下で紫色に変化し、応力を 除くと可逆的に白色に戻った。

Table1. Chromic Behavior of Spiropyrans & Formation of MC aggregates

Spiropyrans	Shear Stress		Formation of MC	
Spiropyralis	under	After experiment	aggregates	
NitroSP Light	→ green → reve	→ Purple — (SP+ _{MC}) rsible	0	
HydroxySP white —	→ green → reve	→ Blue - (MC+ _{sP}) rsible	Δ	
NaphtoSP white reve	→ purple rsible	White (SP)	×	

図2に、ラマンスペクトルを示す。

NitroSP では、応力下の緑色(b)は強い蛍光のため に振動スペクトルを測定できないが、応力後の紫色 (c)では蛍光は弱くなり、実験前の SP 型(a)に A 1120 cm⁻¹と B 1450 cm⁻¹の弱いバンドを重ねた形状をし ている。このバンドは凝集体(d)でも観測され、MC の存在を示している。ずれ応力後の NitroSP は主に SP 型であるが、一部はずれ応力によって異性化し た MC として存在していると考えられる。

HydroxySPの実験前(a,白色)にはA1300 cm⁻¹やB 1600 cm⁻¹に明瞭なバンドがあるが、応力下の緑色 (b)は蛍光が強く、バンドは見えない。応力後の青色 (c)では蛍光は弱くなり、応力前(a)とは異なる位置に バンドをもつスペクトル(c)が現れた。HydroxySP の シクロヘキサン溶液に紫外光を照射すると、MC 凝 集体が青色粉末として生成した。このスペクトル(d) は青色(c)とほぼ同一の形状であった。このことは、 ずれ応力によってHydroxySP はほぼすべてMC に異 性化し、応力を除いた後も、MC 凝集体として安定 に存在することを示している。

NaphtoSP では、応力前(a)の A、B などのバンド が応力下(b)では幅広く、高波数に移動し、応力後の (c)は、応力前(a)とほぼ同じ形状に戻った。NaphtoSP のシクロヘキサン溶液に紫外光を強く長時間照射 したが、生成物は得られなかった。また、溶液での MC への異性化によるフォトクロミズムも観察でき ず、NitroSP や HydroxySP に比べて SP 型が安定で

あり、MCを生成しにくい構造であると考えられる。





そのため、ずれ応力下の紫色では NaphtoSP は閉環構造を保ち、応力を除くことで可逆的に元 の構造に戻ったと考えられる。以上のように、ずれ応力によって NitroSP と HydroxySP から MC を生成し、応力後の状態は MC 凝集体の安定性と関係し、NitroSP はわずかな MC と共存 する SP 型に戻るが、HydroxySP は MC 型になる。また、NaphtoSP は SP 構造を保ち、可逆的 な色変化を示すことが明らかとなった。

I. Shirotani *et al.*, *Proc. Japan Acad. Ser. B*, **79**, 267 (2003).
 M. Inokuchi *et al.*, *J.Low Temp. Phys.*, **142**, 211 (2006).

^{1.} M. Inokuchi *et al.*, *Synth. Met.*, **152**, 421 (2005).

^{4.} 分子科学討論会 2010 (本会) 3P049, 2009 3P045、日本化学会春季年会 2010 1PB-061, 1PB-062.

凝縮系の構造研究における熱力学的アプローチと精密熱測定

(阪大院理) 稲葉 章

【 緒言 】 構造研究の代表は結晶構造解析であり,原子の位置を決めるのは基本的で重要な作 業である.今日では,走査トンネル顕微鏡を使えば実空間でも原子レベルで構造を観察できる. 一方,さまざまな分光法によって構造に関する知見が得られ,動的な構造を含めれば構造研究の 手法は数え切れない.このような広い意味での構造研究に,熱力学的なアプローチがどう寄与で きるかを示すのがここでの主旨である.そもそも,熱はエネルギーの成れの果てと言ってよいが, われわれの仕事はゴミ箱から宝石を見つけ出すようなものである.とにかく,そこにはたいてい の情報が全部ある.それが分光法と違うところである.精度のよいデータさえあれば,狙いを定 めて追究しているうちに宝に出くわす"かもしれない"というところが醍醐味である.

【相転移やガラス転移】研究対象とする物質の相の同定にしばしば熱測定が使われる.また, 転移温度や転移エンタルピー,転移エントロピーは,相転移の機構を解明するのに重要な熱力学 情報である.一次転移か二次転移か,秩序-無秩序型か変位型か,準安定相か非平衡相(ガラス 状態)かを踏まえずに凝縮系の構造研究はあり得ない.この点で熱力学は確実に貢献している.

【 格子振動 】 一昔前と違って中性子散乱実験が手軽に実施できるとはいえ,格子力学的な研 究は非常に大がかりである.一方,低温熱容量を測定すれば格子振動スペクトルの大まかな情報 は得られる.経験してみれば分かるが,熱容量というスカラー量の温度変化は,想像以上に豊富 で重要な情報をもたらしてくれる.詳細な議論になるが,時間があれば例を示して触れたい.

【 熱力学第三法則と統計力学的エントロピー 】 物理化学の教科書には,残余エントロピーを 示す物質として水や一酸化炭素の例が必ず記載してある.前者は水素結合プロトンの位置の凍結 (*Tg*=107 K)であり,後者は分子がもつ双極子の配向の凍結(*Tg*=18 K)による.そこで,グラ ファイト表面に一酸化炭素を吸着させた単分子膜について,熱容量を測定した結果が図1である. 5.4 K に観測された転移は,双極子をもたず相対分子質量の等しい窒素の単分子膜では見られな

い. 転移エントロピーが $R \ln 2$ であるこ と,吸着熱測定とあわせて熱力学第三法 則エントロピーを求めたところ統計力学 エントロピーと一致したことを証拠とし て,双極子の配向が完全に秩序化したも のであると結論した.双極子の具体的な 秩序構造は未だに決められていないが, 熱力学的証拠だけから,この種の秩序化 転移であることは断言できる. CO と N₂ の室温での標準モルエントロピーには 6 $J K^{-1} mol^{-1}$ の差があるが,これは回転対 称数に起因するものなのである.



図 1. グラファイト表面に吸着した CO (○) およ び N₂ (●) の単分子膜の熱容量.

より純粋に回転対称数の問題を扱うには、分子の対称性を低下させる同位体置換を行うことである. たとえば、メチル基は一次元回転子と見なせるが、-CH₃および-CD₃では対称数は 3、

-CH₂D および-CHD₂では対称数は 1 である. 同じ分子であれば気体の標準エントロピーは,後 者が *R*ln 3 だけ大きい.重水素化によっても融解 エントロピーは大きな変化を伴わず,つまり *R*ln 3のエントロピーは低温の固体まで持ち越される. しかし,この過剰エントロピーはたいてい極低温 で解放される.図2は,固体のジクロロトルエン で観測された過剰熱容量である.エントロピーは *R*ln 3に等しく,極低温でメチル基の配向が秩序 化することは明らかである.ただし,相転移を伴 わずに秩序化が進行するので,これにはメチル基 が結晶中で感じるポテンシャルに関係するエネル ギー準位が反映されているはずである.図3は,固 体ガンマピコリンの熱容量である.この場合はメチ ル基の重水素化に伴い相転移が誘起される.



図 2. メチル基を部分重水素化した 固体ジクロロベンゼンの過剰熱容量.

【エネルギー準位の決定】 図4は、グラファイト表面に吸着した CH₃D 単分子膜の熱容量で ある.メタンは三次元回転子であり、回転対称数は-CH₄および-CD₄では12,-CH₃D および -CHD₃では3,-CH₂D₂では2である.ここでの興味は、CH₃D がグラファイト表面に吸着し たとき、C-D が表面に向かう配向(D-down)とC-D が表面を避ける配向(D-up)でどちらが 安定かである.このエネルギー差は中性子散乱では見えないのである.結論は、D-up がエネルギ ーが高いのであるが、それは2Kをピークとする熱容量から分かった.ボルツマン分布を前提と した古典的な平衡熱力学であるが、熱力学的アプローチによって得られる構造情報は意外に多い.



図 3. メチル基を部分重水素化した固体 ガンマピコリンの熱容量.



図 4. グラファイトに吸着した CH₃D 単分子膜の熱容量.

ホスホン酸を有する配位高分子の合成とプロトン伝導性

(京大院理*、JST-CREST**) ○山田 鉄兵*、北川 宏**

【序】我々は配位高分子を用いたプロトン伝導体の開発を目指して研究を行ってきた。これまで に一次元シュウ酸金属二水和物の高プロトン伝導性を見出し、¹また二次元ハニカム型シュウ酸金 属錯体の内部に種々のプロトンドナーを導入し、高プロトン伝導体を創成することに成功してき た。²

配位高分子は高い規則性を有する細孔を有し、金属イオンと配位子を選択することでその内部 の環境を自在に制御できる。プロトン伝導性配位高分子の創成にあたり、配位子にプロトンドナ ーとなる酸性基を自在に導入し、水などの吸着ゲスト分子を利用すれば、プロトン伝導性の制御 が可能になると期待される。しかし、酸性基も金属への配位能を有するため、酸性基の導入は困 難である。そこで我々は配位子を保護し、錯形成を行った後に脱保護することで官能基を導入す る、保護-脱保護法を開発し、この方法により、フェノール性水酸基を配位高分子の細孔表面に 導入することに成功した。³しかしながら得られた配位高分子は DMF 非存在下では水分子の吸脱 着が行えず、水分子を介したプロトン伝導性の評価には至っていない。

今回、我々はさらに酸性度の高い官能基としてホスホン酸基及びカルボン酸基に注目し、それ ら酸性基の導入を保護-脱保護法を用いて試みた。また得られた配位高分子への水分子吸着挙動 を調べると共にプロトン伝導性の評価を行い、精密に制御された細孔内における水分子を介した プロトン伝導性の発現と、それによるプロトン伝導性について評価を試みた。

【実験】配位子として、3,5-ジカルボキシフェニルホスホン酸ジイソ プロピル (H₂dppip、図1)を用いた。臭化ニッケル存在下、5-ブロモ メタキシレンと亜リン酸トリイソプロピルとを反応させて3,5-ジメチ ルフェニルホスホン酸ジイソプロピルを得た。さらにこれを過マンガ ン酸カリウムで酸化することで配位子を得た。

得られた配位子および 4,4'-ビピリジン (bpy) を、種々の溶媒及び温度条件下で金属塩と反応させ、種々の配位高分子を合成した。得られた配位高分子は単結晶 X 線構造解析により構造を決定した。

120°C、水溶媒下での水熱合成により得られたサンプルを [Zn(Hppip)(bpy)_{1/2}]、120°C、水及び DMF の混合溶媒下で得られたサン プルを(dma)[Zn(ppip)]、また 180°C、水溶媒、での反応により得られた サンプルを[Zn(H₂pip)(bpy)_{1/2}]と呼ぶ。[Zn₂(ipip)₂(bpy)]については 50°C で 24 時間乾燥したサンプルを用いて水分子吸着等温線測定を行った。



【結果と考察】合成時の温度や溶媒により、多様な骨格を有する配位

高分子が得られた。得られた3つの化合物の結晶構造を図2に示す。配位高分子[Zn(Hppip)(bpy)_{1/2}] は、ホスホン酸基の一つのイソプロピル基が脱離し、2つの亜鉛を架橋しており、2つのカルボン 酸基の一方は亜鉛に配位していた。一方、残りの一つのカルボン酸基は金属イオンに配位せず、 カルボン酸がそのまま残っていた。(dma)[Zn(ppip)]においてもホスホン酸基の一つのイソプロピル 基が脱離し、亜鉛を架橋しており、2つのカルボン酸基も亜鉛に配位していた。また配位高分子 の骨格は全体としてアニオンになっており、カウンターイオンとしてジメチルアンモニウム(dma) を細孔内に含んでいた。高温での水溶液中で得られた[Zn(H₂pip)(bpy)_{1/2}]はすべてのイソプロピル 基が脱離しており、ホスホン酸部位が3つの亜鉛を架橋した構造を取っていた。2つのカルボン 酸基は共に金属には配位せず、プロトンを有していた。これらの結果から、反応条件により、ホ スホン酸部位の脱保護の割合を制御できることがわかった。また、溶媒や反応条件を制御するこ とで、カルボン酸基を細孔内に導入することに成功した。



図 2 [Zn(Hppip) (bpy)_{1/2}](左)、(dma)[Zn(ppip)](中央)および[Zn(H₂pip)(bpy)_{1/2}](右)の結晶構造。簡明の ため水及びカウンターイオンは除いてある。

[Zn(H₂pip)(bpy)_{1/2}]の水分子吸着組成等温線を図2に 示す。図2より、[Zn(H₂pip)(bpy)_{1/2}]は低圧下で1分子 の水分子を吸着することがわかった。またこの吸着特 性は可逆であることもわかった。図1の結晶構造中に は1分子の水分子が取り込まれており、配位子のカル ボン酸基と水素結合を形成している。このことから、 水分子の吸脱着により水素結合が可逆に組み替わっ ていることがわかった。これら化合物のプロトン伝導 性は、水素結合の組み替えに依存すると考えられるこ とから、プロトン伝導性についても報告する。



- (1) Yamada, T.; Sadakiyo, M.; Kitagawa, H. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3144.
- (2) Sadakiyo, M.; Yamada, T.; Kitagawa, H. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9906.
- (3) Yamada, T.; Kitagawa, H. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6312.

ビリジル基を有するTTF誘導体を用いたプロトン性伝導性錯体の結晶構造と物性 (東大物性研)〇李相哲,高橋一志,森初果

【序】

有機固体中におけるプロトンの移動は、周囲の電子状態変化とカップルして大きな外場応答を 示すことがある。最近報告された有機酸/塩基からなる共結晶では、π系の分子軌道の変化を伴う プロトン変位が強誘電性の起源になっている。[1]分子性導体ではπ電子が電気伝導性を担うため、 プロトン移動とπ電子系が相関する系を分子設計することで、両者の相関した新たな物性が発現す る可能性がある。過去の研究では、プロトン伝導性と電気伝導性の両方を有する物質が報告され ている。しかし、プロトン伝導と電気伝導が別々のカラムで起こるため、プロトン移動と電気伝 導性に直接的な相関は見られていない。[2]

そこで我々は、電子供与部位とプロトン受容部位の両方からなる分子を用いることで、プロトン移動が電気伝導パスに隣接して起こり、プロトン移動と電気伝導性が相関するような有機伝導体の開発を目指している。本研究では、プロトン受容性をもつピリジル基を置換基として導入したテトラチアフルバレン誘導体 Py-TTF を合成し、プロトン化による電子状態の変化[3]を調べた。また、Py-TTF を用いてプロトン性伝導体の作製を行い、その結晶構造および伝導性を調べたので報告する。

【実験】

ドナー分子 Py-TTF は、トリブチルスズ TTF と 4-ヨードピリジンとの Stille カップリングにより合成した。[4] Py-TTF のプロトン化前後での電子状態を、UV-vis スペクトル、CV 測定、および PM3 法を用いた分子軌 道計算により調べた。また、Py-TTFを HBF₄によってプロトン化することで得た(PyH-TTF)BF₄·H₂O を原料 とし、F₄TCNQ および Li(F₄TCNQ)とアセトニトリル中で反応させることで、電気伝導性を有する F₄TCNQ 錯体が得られた。F₄TCNQ 錯体の室温結晶構造は、リガク MercuryCCD X 線回折計で反射を収集し、 Crystal Structure ver.3.8を用いて解析を行い決定した。F₄TCNQ 錯体の抵抗率の温度依存性はカーボン ペーストを電極とした 4 端子法で、160~290 K で測定した。

【結果と考察】

Py-TTF のプロトン化前後で の吸収スペクトルによると、プロ トン化される前では 428 nm に 見られた吸収ピークが、プロト ン化により 573 nm に長波長シ フトしていた。また、CV 測定に より、プロトン化による酸化電位 の増加が見られたことから、 プロトン化により分子のドナ



ー性が低下することがわかった。分子軌道計算を行ったところ、HOMOの軌道はTTF上に、LUMOの軌 道はピリジル基上にそれぞれあることが分かった。したがって吸収ピークは分子内電荷移動によるものだ と考えられる。図1は Py-TTF およびプロトン化された Py-TTF の分子軌道のエネルギー準位図である。 プロトン化による HOMO の準位の低下が見られるが、これはプロトン化によるピリジル基の電子求引性の 増大を意味していると考えられる。また、プロトン化による LUMO の準位の低下が HOMO の準位の低下 よりも大きいため、プロトン化により HOMO-LUMO 間のエネルギー差が減少している。これは、実験により 観測された分子内電荷移動バンドの長波長シフトと矛盾の無い結果である。このように、Py-TTF がプロト ンと電子の移動により様々な電子状態をとることが実験と計算により確かめられた。

F4TCNQ 錯体の構造を図 2 に示す。結晶学的 に独立な 2 つのドナー分子(ドナーA,B)および 2 つのアクセプター分子(アクセプターC,D)が存在し、 ドナーとアクセプターそれぞれがカラムを形成する 分離積層型構造をもつことがわかった。TTF 部分 の結合長からドナーA,B それぞれの電荷を見積も ったところ、ドナーA,B のおおよその電荷はそれぞ れ0、+1であった。ドナーAの側にプロトンが存在し、 N-H 結合を形成していることから、ドナーA はプロト ン化された Py-TTF であると考えられる。また、ドナ ーB は Py-TTF のカチオンラジカルであると考えら れる。ドナーA.B 間の窒素原子間距離が 2.764(6) A と短いことから、プロトンは 2 つのピリジル基の間で N-H⁺…N型(TTF-PyH+…Py-TTF^{+*})の水素結合を形成し ていると考えられる。ドナーA.B は交互に積層しており、プ ロトン誘起の電荷秩序を形成している。一方アクセプター 分子の結合長から、アクセプターC.D はどちらも-1 の電荷 を持つことが示唆された。したがって F4TCNQ 錯体の組成 は[(PyH⁺-TTF)(Py-TTF⁺)(F₄TCNQ⁻)₂·CH₃CN]であること



的な電気伝導性を有していた(図 3)。ドナーとアクセプターの比が 1:1 である F4TCNQ 錯体では、ドナー からアクセプターへの電荷移動度が1になりやすく、10⁴ Ωcm 程度の絶縁体が多い。[5,6] したがって本 実験で得られたF4TCNQ 錯体においても、アクセプターのカラムが主な電気伝導を担っているとは考えに くい。また、δ-(EDT-TTF-CONMe₂)2AsF₆は0価と+1価の電荷をもつドナーが交互に積層することで電荷 秩序を形成しているが、その常圧下での抵抗率は我々が作製した F4TCNQ 錯体の約7倍大きい。[7]以 上のことから、ドナー間の水素結合中のプロトンの熱運動による電荷秩序のゆらぎが、F4TCNQ 錯体のも つ比較的高い伝導性の起源になっている可能性がある。

【参考文献】

- [1] S. Horiuchi et al., J. Mater. Chem., 19, 4421 (2009).
- [3] Q.-Y. Zhu et al., Inorg. Chem., 46, 10065 (2007).
- [5] T. Hasegawa et al., Synth. Met., 86, 1801 (1997).
- [7] K. Heuze et al., Adv. Mater., 15, 1251 (2003).
- [2] T. Akutagawa et al., Chem.-Eur. J., 8, 4402 (2002).
- [4] L. Wang et al., Inorg. Chem., 45, 6860 (2006).
- [6] Y. Ji-min, Solid. State. Commun., 84, 895 (1992).

中性子回折による配位高分子錯体の水素吸蔵状態について

(北大院・理¹, 横市大院国際総合科学², 東大・物性研³) 〇柿崎 圭紀¹, 武内 大隼¹, 丸田 悟朗¹, 高見澤 聡², 武田 定¹, 山田 武³, 山室 修³

【序】

環境やエネルギー資源の問題から、新たな エネルギー源として水素が注目されており、 その利用に関しては、水素を貯蔵する方法の 研究が盛んに行われている。これまで我々は 圧力変化と温度変化により、水素を分子状態 で吸脱着する一次元配位高分子錯体である $[M_2(bza)_4pyz]_n^{-1)}$ (M = Rh, Cu, bza = C_6H_5COO , pyz = $C_4H_4N_2$)について、¹H 核 NMR、重水素核 NMR、中性子非弾性散乱実 験を通して、取り込まれた水素・重水素の吸 蔵状態と運動状態の研究をしてきた。

以前行った重水素核 NMR 実験の結果か ら、取り込まれた重水素が異なる 2 つの吸 着サイト間を flip-flop 運動をしているとモ デル化した時に、実験データによく一致す ることがわかっている。さらに、錯体内に 吸蔵されている水素・重水素の回転エネル ギー遷移のスペクトルを得るため中性子 非弾性散乱実験を行い、4 種類の回転エネ ルギー遷移を見い出した。我々はこれらの 結果から、2 つの吸着サイトに吸蔵されて いる水素分子について、それぞれ 2 種類の 遷移を観測したと考えている。



図 1. [M₂(bza)₄pyz]の結晶構造



図 2.X 線結晶構造解析による [M₂(bza)₄pyz]に吸蔵されている水素

これら非弾性中性子散乱および固体重水素核 NMR の測定結果を総合的に詳しく解析するためには X線結晶構造解析では得られない水素分子の詳細な位置を含む構造解析がぜひとも必要である。このため、最近立ち上がった J-PARC の粉末結晶用超高分解能中性子回折装置 SuperHRPDを用いて中性子回折測定を行った。

¹⁾S.Takamizawa, E.Nakata CrystEngComm, 2005, 7, 476-479

【実験】

 · [Rh₂(bza-d₅)₄pyz-d₄]と[Rh₂(bza-d₅)₄pyz-d₄](3D₂)の中性子回折実験
 J-PARC に設置された高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の SuperHRPD
 を用いて測定を行った。完全に重水素化した 2. 63g の[Rh₂(bza-d₅)₄pyz-d₄]を用いて測定し
 た。重水素の吸蔵は自作の中性子回折用プローブを用いて行った。測定温度は 80K と 30K
 の 2 点で、重水素を吸蔵させたものと錯体のみとで、計 4 種類の測定を行った。



【結果】

右の図4,図5には中性子回折の測定結果を示した。80Kと30Kの温度で、共に重水素を吸蔵させた錯体と錯体のみとでは回折パターンに明確な違いが見られるため、重水素分子の詳細な位置を決定できると期待される。現在、解析中であるが詳細を報告する。



水素結合部位を有するシュウ酸架橋配位高分子における 選択的ガス吸蔵特性

(京大院理¹, JST-CREST²) ○貞清 正彰¹, 山田 鉄兵¹, 大川 尚士², 北川 宏^{1,2}

【序論】配位高分子は構造の設計性と多様性を持ち、多様な物性発現へのアプローチが可能 であることから近年大きな研究領域を形成している。特に、配位高分子に特有な高い空隙率 を持つ規則的な細孔や、動的な構造変化を伴う特異なガス吸着特性は、ガス貯蔵材料・分離 材料として興味が持たれ、盛んに研究が行われている。

我々は配位高分子を用いたプロトン伝導体を創製する過程で、層状構造を持つ[M₂(ox)₃]^m フレームワークを用いて細孔内に水素結合ネットワークを導入したシュウ酸架橋二次元配位 高分子(H₂dab)[Zn₂(ox)₃]·*n*H₂O (ox^{2·} = oxalate, H₂dab²⁺ = 1,4·diammonium butane, *n* = 0, 2, 6)の合成に成功し、この配位高分子が水蒸気圧に応じて結晶・結晶転移を起こし、ヒステリシ スを伴った 2 段階の水吸着挙動を示すことを報告した。この配位高分子は電子対供与型 (C₂O₄²⁻)および受容型(·NH₃⁺)の水素結合部位を同時に持っており、単結晶 X 線構造解 析の結果から、*n* = 2, 6 のいずれにおいても、水分子は水素結合部位であるアンモニウム基と シュウ酸イオンの両方と水素結合することにより細孔内に束縛されていることが明らかとな っている。そのため、吸着時の結晶・結晶転移は吸着質とフレームワークとの水素結合相互作 用により引き起こされるものと予想された(図 1)。

そこで本研究では、他の吸着質に対する吸着特性・吸着選択性を明らかにするために、水 素結合可能なヒドロキシ基を有するアルコールと非プロトン性有機溶媒に対する吸着特性、 および吸着時の構造の評価を行った。

【実験】測定試料には水熱合成法により合成した(H₂dab)[Zn₂(ox)₃]·*n*H₂O を用い、80℃で加 熱脱気した後に吸着測定に用いた。水以外で官能基と分子サイズの異なる各種吸着質(MeOH, EtOH, MeCN, MeCHO, Me₂CO, Me₂CH(OH), PrOH, BuOH, N₂ (77 K), H₂ (77 K))を用いて 298 K において吸着組成等温線測定を行った。また、ガス雰囲気下における粉末 X 線回折測 定を行った。



図 1 (H₂dab)[Zn₂(ox)₃] 2H₂O の結晶構造 (左) 層間方向投影図 (右) 細孔中の水分子の水素結合

【結果と考察】吸着組成等温 線測定の結果を図 2 に示す。 水分子と同様にヒドロキシ基 を有する MeOH では、P/Po = 0.3付近で約4分子の吸着が観 測された。また、EtOH にお いても P/Po = 0.4付近で約3 分子の吸着が観測され、両者 とも、水分子と同様に脱着時 に大きなヒステリシスが観測 された。一方、ヒドロキシ基 がない極性分子 MeCN、 MeCHO、Me₂CO では吸着が 観測されなかった。また、ヒ



ドロキシ基を有しているが、EtOH よりも分子サイズの大きい PrOH、BuOH、Me₂CH(OH) についても吸着が観測されなかった。さらに、分子サイズの小さい無極性分子 N₂と H₂につ いても吸着が観測されなかった。これらのことから、分子サイズや極性という要因だけでな く、ヒドロキシ基の有無により吸着の選択性が発現していることが示唆された。また、MeOH および EtOH は再測定の結果、可逆的な吸着であることがわかった。

ゲスト分子を取り込んだ(H₂dab)[Zn₂(ox)₃]·4MeOH および(H₂dab)[Zn₂(ox)₃]·3EtOH の構 造に関する知見を得るため、乾燥した後に MeOH、EtOH 蒸気 (P/P₀ = 0.9~) をそれぞれ導

入して粉末 X 線回折測定を行った 結果を図3に示す。MeOH 体、 EtOH 体ともに、無水物とは異なる ピークパターンを示し、吸着に伴う 構造変化が起きていることが明ら かとなった。MeOH および EtOH 吸着測定後、大気中にさらした試料 の粉末 X 線回折測定を行った結果、 どちらも合成後の状態である (H2dab)[Zn2(ox)3]・2H2Oのピークパ ターンを示したことから、これらの 吸着過程は可逆的な結晶・結晶転移 であることが明らかとなった。当日 は詳細な構造と吸着との関連につ いて議論する。



図3 ガス雰囲気下における粉末X線回折パターン